

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60191-2

AMENDEMENT 10
AMENDMENT 10
2004-03

Amendement 10

**Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs –**

**Partie 2:
Dimensions
(standards.iteh.ai)**

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c901028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004>

**Mechanical standardization of semiconductor
devices –**

**Part 2:
Dimensions**

*Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans la
Publication 60191-2*

*The sheets contained in this amendment are to be
inserted in Publication 60191-2*



CODE PRIX
PRICE CODE

L

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60191-2:1966/AMD10:2004](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c99b028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c99b028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004>

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES DANS LA CEI 60191-2

Remplacer la page de titre existante par la nouvelle page de titre.

Retirer la page 60191 IEC I existante contenant la préface et la remplacer par la nouvelle page 60191 IEC I contenant la préface à l'amendement 10 (2004).

Chapitre I:

Ajouter les nouvelles feuilles suivantes:

60191 IEC I-156E - a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l.

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES IN IEC 60191-2

Replace the existing title page with the new title page.

Remove the existing page 60191 IEC I containing the preface and insert in its place the new page 60191 IEC I containing the preface to Amendment 10 (2004).

Chapter I:

Add the following new sheets:

60191 IEC I-156E - a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60191-2:1966/AMD10:2004](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c99b028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c99b028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004>

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60191-2:1966/AMD10:2004](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c99b028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c99b028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004>

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
60191-2
Première édition
First edition
1966

Modifiée selon les Compléments:
Amended in accordance with Supplement:
A (1967), B (1969), C (1970), D (1971), E (1974), F (1976),
G (1978), H (1978), J (1980), K (1981), L (1982), M (1983),
N (1987), P (1988), Q (1990), R (1995), S (1995), T(1995),
U(1997), V(1998), W(1999), X(1999), Y(2000), Z(2000)
et/and Amendement/Amendment 1 (2001), 2(2001), 3(2001),
4(2001), 5(2002), 6(2002), 7(2002), 8(2003), 9(2003), 10(2004)

**Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs –**

**Partie 2:
Dimensions**

iTeh STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)
**Mechanical standardization of semiconductor
devices –**

[IEC 60191-2:1966/AMD10:2004](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c990028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c990028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004>

**Part 2:
Dimensions**

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60191-2:1966/AMD10:2004](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c99b028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c99b028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004>

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PUBLICATION 191-2

**NORMALISATION MÉCANIQUE
DES DISPOSITIFS À
SEMICONDUCTEURS**

DEUXIÈME PARTIE: DIMENSIONS

SOMMAIRE

PRÉAMBULE	
PRÉFACE	
CONCEPTION DE LA NORMALISATION MÉCANIQUE	Chapitre 00
VALEURS RECOMMANDÉES POUR CER- TAINES DIMENSIONS DE DESSINS DE DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS	Chapitre 0
DESSINS D'ENCOMBREMENTS	Chapitre I
TYPES DE DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS GÉNÉRALEMENT MONTÉS DANS LES BOÎTIERS DU CHAPITRE I	Chapitre I
DESSINS D'EMBASES	Chapitre II
DESSINS DE BOÎTIERS	Chapitre III
DESSINS DE CALIBRES	Chapitre IV
TABLEAUX MONTRANT LES ASSOCIA- TIONS ENTRE LES BOÎTIERS ET LES EMBASES	Chapitre V
DESSINS OBSOLÈTES	
COMPLÉMENTS AUX LISTES DE CODES NATIONAUX FIGURANT SUR LES FEUILLES DES NORMES DE LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI	
SUPPRESSIONS DANS LES LISTES DE CODES NATIONAUX FIGURANT SUR LES FEUILLES DE NORMES DE LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI	

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PUBLICATION 191-2

**MECHANICAL STANDARDIZATION
OF SEMICONDUCTOR
DEVICES**

PART 2: DIMENSIONS

CONTENTS

FOREWORD	
PREFACE	
PHILOSOPHY OF MECHANICAL STAN- DARDIZATION	Chapter 00
RECOMMENDED VALUES FOR CERTAIN DIMENSIONS OF DRAWINGS OF SEMI- CONDUCTOR DEVICES	Chapter 0
DEVICE OUTLINE DRAWINGS	Chapter I
TYPES OF SEMICONDUCTOR DEVICES GENERALLY MOUNTED IN THE PACKAGES OF CHAPTER I	Chapter I
BASE DRAWINGS	Chapter II
CASE OUTLINE DRAWINGS	Chapter III
GAUGE DRAWINGS	Chapter IV
TABLES SHOWING ASSOCIATIONS BE- TWEEN CASE OUTLINES AND BASES	Chapter V
OBSOLETE DRAWINGS	
ADDITIONS TO THE LISTS OF NATIONAL CODES APPEARING ON THE STANDARD SHEETS OF IEC PUBLICATION 191-2	
DELETIONS TO THE LISTS OF NATIONAL CODES APPEARING ON THE STANDARD SHEETS OF IEC PUBLICATION 191-2	

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Amendement 10 (2004) à la CEI 60191-2 (1966) **NORMALISATION MÉCANIQUE DES DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – Partie 2: Dimensions**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) attire l'attention sur le fait qu'il est déclaré que la conformité avec les dispositions du présent document peut impliquer l'utilisation d'un brevet.

La CEI ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à la portée de ces droits de propriété.

Le détenteur de ces droits de propriété a donné l'assurance à la CEI qu'il consent à négocier des licences avec des demandeurs du monde entier, à des termes et conditions raisonnables et non discriminatoires. A ce propos la déclaration du détenteur des droits de propriété est enregistrée à la CEI. Des informations peuvent être demandées à:

Micron Technology, Inc.
 8000 S. Federal Way
 P.O. Box. 6
 Boise, ID 83707-0006
 208.368.4000
 USA

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Amendment 10 (2004) to IEC 60191-2 (1966)

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES –

Part 2: Dimensions

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.

The International Electrotechnical Commission (IEC) draw attention to the fact that it is claimed that compliance with this document may involve the use of a patent.

IEC take no position concerning the evidence, validity and scope of this patent right.

The holder of this patent right has assured the IEC that he is willing to negotiate licences under reasonable and non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world. In this respect, the statement of the holder of this patent right is registered with IEC. Information may be obtained from:

Micron Technology, Inc.
8000 S. Federal Way
P.O. Box. 6
Boise, ID 83707-0006
208.368.4000
USA

PRÉFACE À L'AMENDEMENT 10 (2004)

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47D: Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47D/571/FDIS	47D/577/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60191-2:1966/AMD10:2004](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c99b028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c99b028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004>

PREFACE TO AMENDMENT 10 (2004)

This amendment has been prepared by subcommittee 47D: Mechanical standardization of semiconductor devices of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47D/571/FDIS	47D/577/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60191-2:1966/AMD10:2004](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c99b028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c99b028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004>

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60191-2:1966/AMD10:2004](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c99b028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a949f7a8-19f3-47c7-a1eb-3c99b028894e/iec-60191-2-1966-amd10-2004>